

**ПАТЕНТНИЙ ФОНД США ЯК ГЛОБАЛЬНА БАЗА  
ПОШУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ,  
РОЗРОБКИ І ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕХНІКИ  
І ТЕХНОЛОГІЙ ШВИДКОГО ПРОТОТИПУВАННЯ (ОГЛЯД)**

Гуцаленко Ю.Г.

*Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут»,  
м. Харків*

Основу патентної середовища огляду склали 150 патентів світового лідера швидкого прототипування, яким є США, з заявочної зацікавленістю національних і транснаціональних компаній, корпорацій і холдингів Canon, Caterpillar, Ford, Fujitsu, General Electric, General Motors, Hitachi, IBM, Intel, Konica, Microsoft, Minolta, Nokia, Philips, Ricoh, Siemens, Samsung Electronics, 3D Systems та ін. в двадцятирічній ретроспективі 1993-2012 рр. (<http://www.freepatentsonline.com>) [1, 2].

У масиві залучених до огляду патентів глобальний масштаб зацікавленості в захисті авторських прав у розглянутому тематичному полі саме в США підтверджується також тим, що більше половини патентів є результатом або первинної заявки без участі резидентів США (20 патентів), або (56 патентів) – звернення за патентним захистом об'єктів інтелектуальної власності, що вже знаходяться під захистом міжнародного (РСТ) або європейського (EP) патенту, патентного права інших високорозвинених країн зі світовим рівнем техніки і технологій (Японії, Канади, Кореї, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Голландії, Китаю, Тайваню, Ізраїлю).

На стійкий характер цієї висхідної тенденції в ретроспективі останнього двадцятиріччя вказують дані табл. 1.

Таблиця 1. - Динаміка репатентування в США (огляд [1, 2])

1993-1996	1997-2000	2001-2004	2005-2008	2009-2012
18,5 %	31,8 %	28,1 %	51,2 %	50,0 %

**Література:**

1. Разработка метода статистического прогнозирования времени полного цикла рабочих процессов технологий лазерной стереолитографии (SLA) и селективного лазерного спекания (SLS): Отчет о НИР (заключит.) / Нац. техн. ун-т «Харк. политехн. ин-т»; рук. А. Грабченко. – Харьков, 2012. – 340 с. – № ГР 0110U001237. – Инв. № 0213U001264.

2. Разработка теоретических основ морфологического анализа 3D образа сложных изделий при подготовке к материализации интегрированными ресурсосберегающими технологиями: Отчет о НИР (заключит.) / Нац. техн. ун-т «Харк. политехн. ин-т»; рук. В. Доброскок. – Харьков, 2012. – 268 с. – № ГР 0110U001238. – Инв. № 0213U001265.